

| 主項儀器代碼 | EM000211 | | | | | | 申請日期 | 2023/1/3 | | | |
|-----------------|---|-------|------------|-------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 儀器名稱 | 理學院穿透式電子顯微鏡 / 高解析穿透式電子顯微鏡/理學院 T12 120keV穿透式電子顯微鏡 | | | | | | 計費項目開放日期 | 2023/2/1 | | | |
| 收費項目名稱 | 英文名稱 | 原計費標準 | | | | | 擬申請變更後計費標準 | | | | |
| | | 單位 | 計畫預約 單價 | 非計畫預約 單價 | 自行操作 計畫計費 單價 | 自行操作 非計畫計 費單價 | 計畫預約 單價 | 非計畫預約 單價 | 自行操作 計畫計費 單價 | 自行操作 非計畫計 費單價 | 備註 (100字為限) |
| 基本使用費 (HR-TEM) | Basic charge for FEI G2 | 小時 | 250 | 2,500 | 300 | 600 | 350 | 2500 | 350 | 600 | 長期收費過低加上維修費過高，營運與拍攝技術成本考量 |
| 委託代測樣品使用費 (TEM) | Service for special case (sample) | 個 | 300 | 3,000 | 0 | 0 | 400 | 3000 | 0 | 0 | 長期收費過低加上維修費過高，營運與拍攝技術成本考量 |
| 數位擷取時數費 | CCD collect-Bam Time (Operate by User) | 小時 | 0 | 0 | 250 | 600 | 0 | 0 | 500 | 700 | 長期收費過低加上維修費過高，營運與拍攝技術成本考量 |
| 數位擷取 | CCD collect-sever time | 張 | 30 | 300 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 長期收費過低加上維修費過高，營運與拍攝技術成本考量 |
| 元素分析EDS | Energy Dispersive Specitrum | 次 | 100 | 1,000 | 60 | 200 | 300 | 1000 | 150 | 300 | 長期收費過低加上維修費過高，營運與拍攝技術成本考量 |
| | | | | | | | | | | | |

變更計費項目說明：長期收費過低加上維修費過高，已經難以負荷。